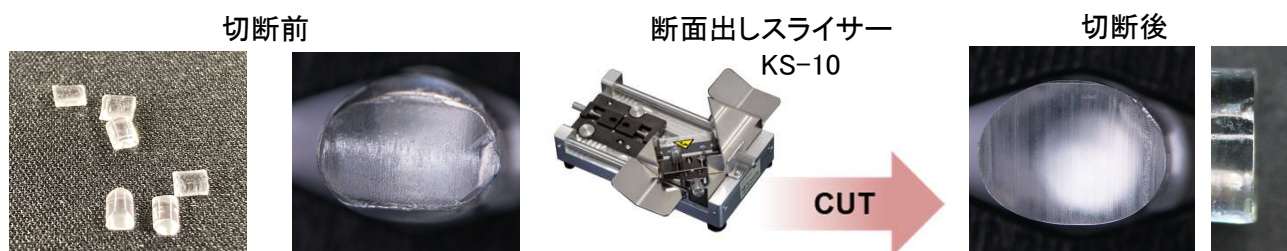
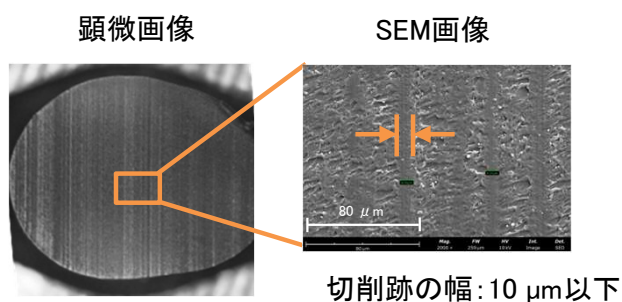


樹脂ペレットの切り出しとSEM観察

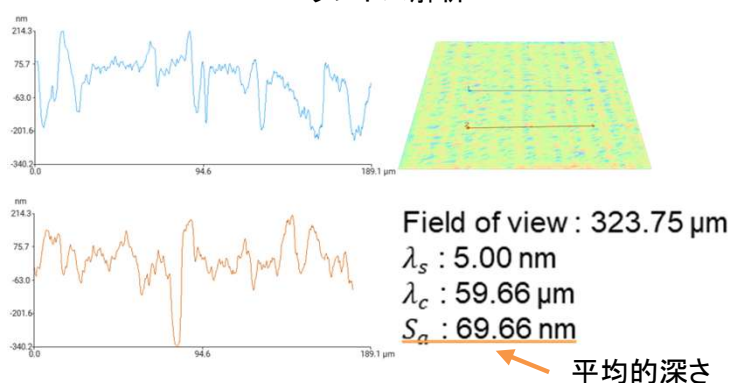
KS-10型断面出しスライサーを使用し切断した樹脂ペレットの断面を電子顕微鏡で観察しました。ミクロトームで切断した断面と比較すると切筋が生じますが、ラフネス解析の結果から分光測定においては問題にならない程度であることが分かります。



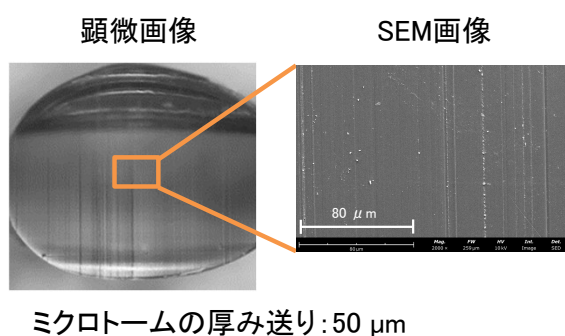
【KS-10による切断面】



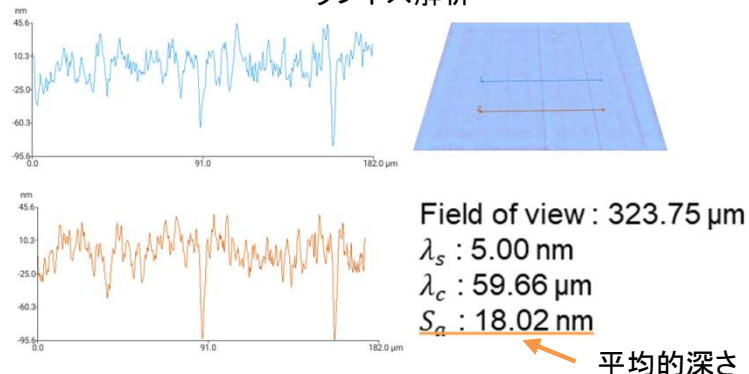
ラフネス解析



【ミクロトームによる切断面】



ラフネス解析



Condition

SEM観察: 倍率2000倍, 二次電子像 (SED) 検出 ラフネス解析: 倍率1000倍, Height Map検出
サーモフィッシャーサイエンティフィック社製卓上走査型電子顕微鏡使用
KS-10型断面出しスライサー使用

Master's Memo

- 切筋の幅が10 μm以下、深さもナノメートルオーダーであることから赤外顕微測定等、分光測定においてはほとんど影響しないレベルの平坦さを得ることができます。